

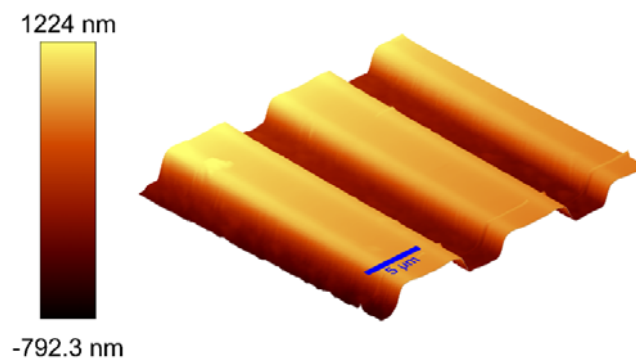
Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esențiale (TGE),
utilizând o PLATformă de interacțiune cu întreprinderile competitive - TGE-PLAT
cod SMIS 2014+ 105623

Tehnica de caracterizare de microscopie de forta atomica

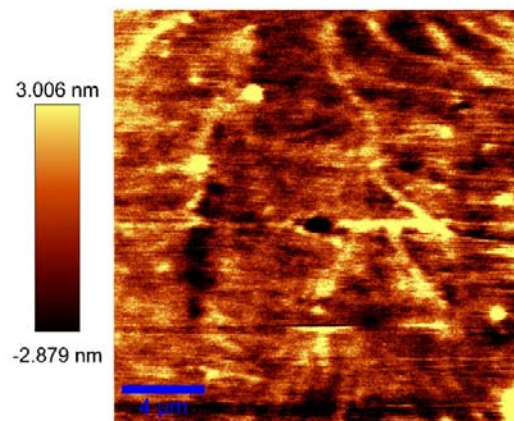
Responsabil: Cristian Kusko. E-mail: cristian.kusko@imt.ro

Descrierea sumara a serviciului

Se efectueaza caracterizari de microscopie de forta atomica (AFM) pentru profilometrie, determinarea morfologiei a micro si nanostructurilor, determinari de rugozitate a suprafetelor, masurari AFM pentru probe biologice, caracterizari nanoparticule depuse pe substrat. Aplicatii specifice pentru optica, optoelectronica si fotonica: masurarea parametrilor geometrici pentru circuite fotonice, determinarea rugozitatii suprafetelor optice (lentile, oglinzi, prisme suprafete plane), profilometrie pentru elemente optice difractive, lentile Fresnel, holograme.



Imagine AFM a unei rețele de difracție



Imaginea AFM a suprafetei unui nanocompozit P3HT+nanotuburi de carbon



Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esențiale (TGE),
utilizând o PLATformă de interacțiune cu întreprinderile competitive - TGE-PLAT
cod SMIS 2014+ 105623

Echipamente/aparate/programe folosite:

alpha 300 A -Nanoscale surface characterization WITec GmbH Germany, 2008
rezolutie laterala 1nm
rezolutie in adancime 0.3 nm
moduri: contact, contact alternativ
arie de scanare 50 μm x 50 μm

Grupul de echipamente descris in bazele de date ERRIS, site-ul IMT-MINAFAB (link)
<https://erris.gov.ro/MINAFAB>

Serviciul este inclus in sistemul de control al calitatii ISO: 9001
Serviciul este asigurat in mod curent prin centrul de servicii IMT/MINAFAB (<http://www.imt.ro/MINAFAB/>)

Contact pentru servicii in cadrul TGE-PLAT:

Raluca Müller (raluca.muller@imt.ro)
Adrian Dinescu (adrian.dinescu@imt.ro)
Tel: 021 269 07 70; Fax: 021 269 0772